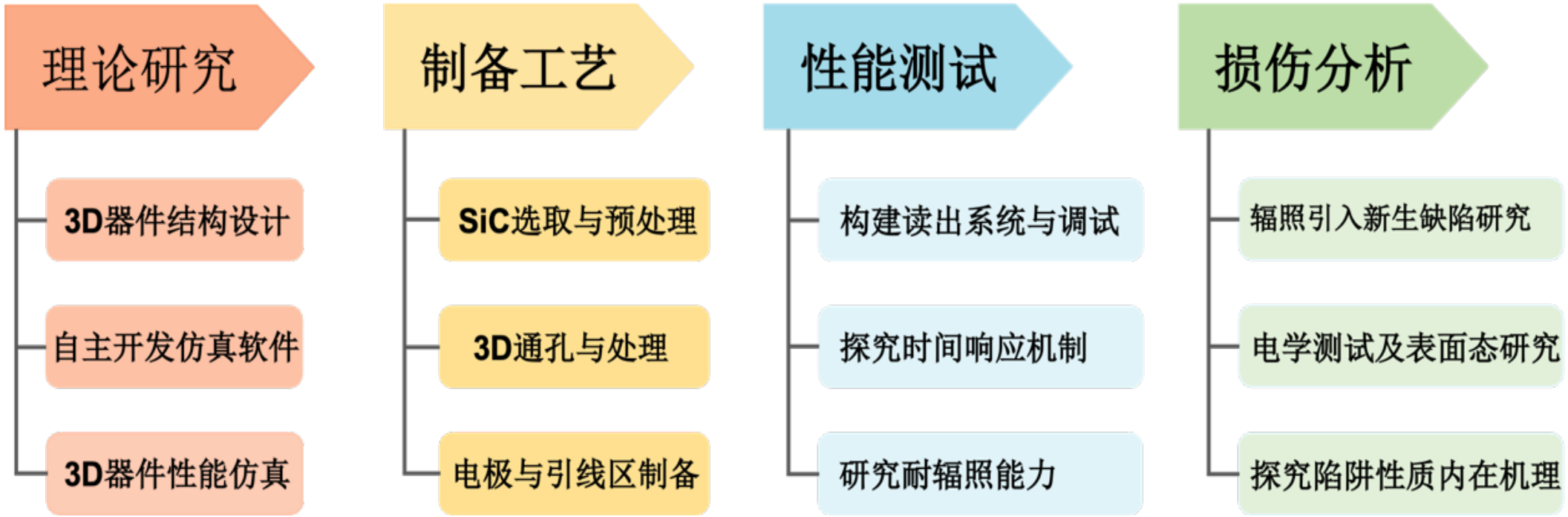
碳化硅探测器 – 性能测试

史欣

2022年5月13日

技术路线


理论研究
3D器件结构设计
自主开发仿真软件
3D器件性能仿真
制备工艺
SiC选取与预处理
3D通孔与处理
电极与引线区制备
性能测试
构建读出系统与调试
探究时间响应机制
研究耐辐照能力
损伤分析
辐照引入新生缺陷研究
电学测试及表面态研究
探究陷阱性质内在机理

性能测试

- 读出系统与调试
- 探究时间响应机制
- 研究耐辐照能力

会议日程

Friday, 13 May 2022

09:00 - 09:10	性能测试 *10'* Speaker: Xin Shi (IHEP)
09:10 - 09:30	激光综述 *20'* Speaker: 晓川 夏 (D)
09:30 - 09:50	定时仿真介绍 *20'* Speaker: TAN Yuhang (高能所)
09:50 - 10:10	硅探测器脉冲形状甄别方法研究 *20'* Speaker: 牛梦臣
10:10 - 10:15	AOB *5'*